

國立交通大學
電子工程學系電子研究所碩士班
碩士論文

超薄氮化矽閘極介電層之可靠度研究

A Study on the Reliability of Ultrathin Oxynitride
Gate Dielectrics



研究生：歐士傑 Shih-Chieh Ou

指導教授：黃調元 Dr. Tiao-Yuan Huang

林鴻志 Dr. Horng-Chih Lin

中華民國九十三年六月